Disc substrates for information recording discs and magnetic discs

Patent number:

US6214429

Publication date:

2001-04-10

Inventor:

ZOU XUELU (JP); TORATANI HISAYOSHI (JP)

Applicant:

HOYA CORP (US)

Classification:

- international:

B32B3/02

- european:

C03C3/062; C03C3/083; C03C3/087; C03C3/095;

G11B5/73N

Application number: U\$19980222869 19981230

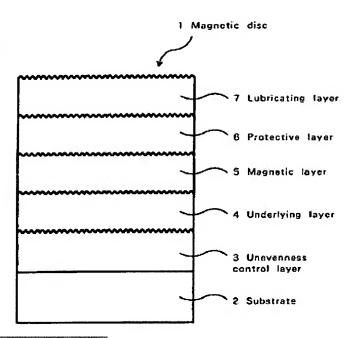
Priority number(s): JP19970217622 19970812; JP19960233933 19960904; JP19960233936 19960904; US19980222869 19981230;

US19970921368 19970829

Report a data error here

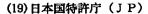
Abstract of US6214429

Disclosed is disc substrate consisting of SiO2-Al2O3-RO (RO=divalent metal) glasses having high specific elastic modulus of 36x106 Nm/kg or more or high Young's modulus of 110 GPa or more, high transition temperature of 700 DEG C. or higher (high heat resistance), excellent surface smoothness (surface roughness Ra<5 AA) and high strength. The substrates exhibiting high specific elastic modulus or high Young's modulus and high strength enables to realize thinner magnetic discs and prevent breakdown of magnetic discs. Since glass substrates being composed of the glass have excellent heat resistance and flatness, the substrates can be subjected to heat treatment for improvement of magnetic layer characteristics and realize smaller flying height of magnetic head, i.e., higher recording density.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide





(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顯公開番号 特開2003-112945 (P2003-112945A)

(43)公開日 平成15年4月18日(2003.4.18)

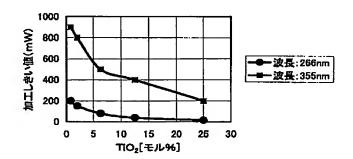
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C 0 3 C	4/08		C 0 3 C 4/08	4G015
C 0 3 B	33/037		C 0 3 B 33/037	4G059
	33/08		33/08	4 G 0 6 2
C 0 3 C	3/091		C 0 3 C 3/091	
	15/00		15/00	Α
			審查請求 未請求	請求項の数2 OL (全 6 頁)
(21)出願番号		特顏2001-309439(P2001-309439)	(71)出願人 000004	008
			日本板	硝子株式会社
(22)出願日		平成13年10月5日(2001.10.5)	大阪府	大阪市中央区北浜四丁目7番28号
			(72)発明者 小用	広隆
			大阪府	大阪市中央区北浜4丁目7番28号
				硝子株式会社内
			(72)発明者 小山	
				大阪市中央区北浜4丁目7番28号
				硝子株式会社内
			(74)代理人 100069	
			开埋工 	大野精市
				最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 レーザ加工用ガラス

(57) 【要約】

【課題】アルカリ金属を含むガラスに、銀イオン交換によって銀イオンを導入すると、レーザ加工しきい値が低下することが知られている。しかし、銀イオンはガラス表面近傍で還元され、ガラス内部へ拡散させることは困難である。このため有効なレーザ加工領域がガラス表面近傍に限られ、ガラス板に貫通孔を開けるなどガラス内部に及ぶ加工は困難である。

【解決手段】吸収したレーザ光エネルギーによるアブレーションあるいは蒸発を利用するレーザ加工に用いるレーザ加工用ガラスに、チタンを原子、コロイドまたはイオンの形態で添加する。溶融によってチタンをガラス中に導入することができるので、チタンの添加量を変えて加工しきい値を制御しやすく、また、均一な加工性を有する材料を得ることができる。







【特許請求の範囲】

【請求項1】吸収したレーザ光エネルギーによるアブレーションあるいは蒸発を利用するレーザ加工に用いるレーザ加工用ガラスにおいて、チタンを原子、コロイドまたはイオンの形態で含むことを特徴とするレーザ加工用ガラス。

【請求項2】組成がつぎの条件を満たすことを特徴とする請求項1に記載のレーザ加工用ガラス。

20≦SiO2+B2O3≦79モル%

1≦A I 2O3+T i O2≦40モル%

5 ≦ L i O2+N a2O+K2O+R b2O+C s2O+M g O+C a O+S r O+B a O ≦ 6 0 モル%

ただし、1≦TiO2≦40モル%とする。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、レーザ光照射によるガラスのレーザ加工に関し、特にレーザ加工に適したガラスの組成に関する。

[0002]

【従来の技術】光通信等に用いる光学部品やディスプレイ装置に組み込むマイクロレンズなど、ガラス基板に微細加工を施した部材は広い分野で用いられている。このようなガラス基板に微細加工を施す方法としては、従来、フッ酸等のエッチング液を用いたウェットエッチング(化学エッチング)、あるいは反応性イオンエッチング等のドライエッチング(物理エッチング)によるのが一般的であった。

【0003】しかしながら、ウェットエッチングにはエッチング液の組成管理と廃液処理の問題がある。またドライエッチングには真空設備等が必要であり、またフォトリソグラフィー技術によってパターンマスク等を形成するなど複雑な工程を必要とし効率的でないという問題点がある。

【 O O O 4 】他方、レーザ光を材料に照射し、加熱、溶融、蒸発、アブレーションなどの物理的変化を起こし、その変化を利用する直接加工技術も進展している。レーザ光は極めて小さなスポットに絞ることができるので、微細加工に適している。完全な物理的加工であるのでウェットエッチングのような問題はなく、また空気中での加工、レーザ光の走査による加工が可能であるので、従来のドライエッチングのような問題点もない。

【0005】レーザ技術の発展により、レーザパルス幅の短縮化、短波長化が実現され、ポリイミド等の有機物や金属の加工においてはマイクロメートルオーダでの加工が可能となっている。 しかしながら、ガラスは脆性材料であるため、加工時にクラックが発生しやすい。そのためガラス材料に関しては微細加工にレーザ加工を用いることは容易でなかった。

【0006】例えば、特開平11-217237号公報には、このような問題を解決するため、ガラスに銀をイ

オン交換で導入することにより、レーザの加工しきい値 を低減させ、クラックの発生しにくいガラスを提供する 技術が開示されている。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、多くのアルカリ金属を含むガラスでは、銀イオン交換によって銀イオンを内部に導入できるものの、銀イオンはガラス表面近傍で還元され、ガラス内部への拡散が阻害されるという現象が生じる。このため有効なレーザ加工領域がガラス表面近傍に限られ、ガラス板に貫通孔を開けるなどガラス内部に及ぶ加工は依然として困難である。また、イオン交換速度が遅く、安定にガラス内部までイオンを到達させることが困難であるという問題もあった。【0008】上記課題を解決するために、本発明ではイオン交換せずに溶融時にガラス中に導入でき、且つ、加工しきい値を低くするような元素を含んだレーザ加工用ガラスを提供することを目的とする。

[0009]

【課題を解決するための手段】本発明の、吸収したレーザ光エネルギーによるアブレーションあるいは蒸発を利用するレーザ加工に用いるレーザ加工用ガラスは、チタンを原子、コロイドまたはイオンの形態で含むことを特徴とする。

【0010】その組成はつぎの条件を満たすことが望ましい。

20≦SiO2+B2O3≦79モル%

1≦A I 2O3+T i O2≦40モル%

 $5 \le L \ i \ O_2 + N \ a_2O + K_2O + R \ b_2O + C \ s_2O + M$ g $O + C \ a_2O + S \ r_2O + B \ a_2O \le 6 \ O \ne 10\%$

ただし、TiO2は1~40モル%含有することが必須 である。

【 O O 1 1】上記の組成のガラスにおいては、レーザ光を吸収した際にガラスの構造の変化若しくは吸収率の変化が生じ、アブレーションあるいは蒸発が生じる。この現象を利用すればガラスの特定部分を除去する加工を施すことができ、加工に必要なエネルギーが少ない低加工しきい値ガラスが得られる。また、本発明のレーザ加工用ガラスは、ガラス表面近傍の加工にとどまらず、ガラス板に貫通孔を開けるなどガラス内部に及ぶ加工も容易に行うことができる。

[0012]

【発明の実施の形態】本発明の目的は、ガラスのレーザ 加工性の改善にあり、その本質はより低いエネルギーに よる加工が、ガラス表面から内部にわたって行えること にある。このようなレーザ加工性を評価する指標として、ガラス表面および内部における加工しきい値を用いた。

【 0 0 1 3】加工しきい値は図2に示す光学系を用いて 測定した。レーザ光源10としてはNd: YAGレー ザの第3高調波(波長:355nm)および第4高調波



(波長:266nm)の紫外光を用いた。このレーザ光源の繰り返し周波数は20Hzで、パルス幅は5~8nsとした。レーザ光は焦点距離100mmのレンズ(図示しない)で集光し、試料ステージ20上の試料ホルダー30に固定したガラス試料40に照射した。照射時間は照射シャッタ50で制御し、2秒とした。

【0014】レーザ光のエネルギーは照射シャッタを閉じた状態で、パワーメータをレーザ光の光路に入れて測定した。このエネルギーを種々変えて試料を照射し、アブレーションが起こる限界のエネルギーを求め、加工しきい値とした。

【0015】なお、レーザ光源12は高エネルギービームを発生するので、安全確保のため、遠隔操作可能とし、レーザ光源12への電源・冷却水供給装置14をリモートコントローラ16により操作する。特に図示していないが、レーザ光源12自身もシャッタを内蔵し、これも遠隔操作が可能である。また試料20を透過したレーザ光はビームダンパ18で吸収する。

【 O O 1 6 】 レーザ加工用ガラスは所定の原料を混合し、電気炉内で溶融後、徐冷することによって作製した。得られたガラスブロックを一般的な方法で切断研磨し、板状で表面が平滑な実験用レーザ加工用ガラス試料を準備した。以下、本発明を用いた実施例を示すが、本発明はこれらの実施例に限定されるものではない。

【〇〇17】 [実施例] 本発明のレーザ加工用ガラスの実施例1~18の組成を表1に示す。実施例1~5は、中間酸化物の量を変化させた組成である。実施例6~8は、実施例5の組成のうちTiO2の量を変えずに網目形成酸化物を変化させた例である。実施例9、10は、実施例5の組成のうちTiO2の量を変えずに修飾酸化物の添加量を変化させた例である。実施例11、12は網目形成酸化物のSiO2と中間酸化物のTiO2の量を大きく変えた組成である。実施例13~18は、実施例5の組成のうちTiO2の量を変えずに修飾酸化物の種類を変化させた例である。

【0018】各成分の組成範囲は単位をモル%として次の範囲にある。

網目形成酸化物 (SiO₂、B₂O₃):20.0~7 9.0

中間酸化物 (A I 2O3、T i O2): 1.0~40.0 ただし、T i O2は1.0~40.0モル%含有していることが必須である。

修飾酸化物(Li₂O、Na₂O、K₂O、Rb₂O、Cs 2O、MgO、CaO、SrO、BaO):5.0~6 0.0

本発明のレーザ加工ガラスは微量の不純物を除いて、実質的に上記の組成物のみからなる。また、TiO2を除いて上記組成範囲を満たす限り、各成分は含有されなくてもよい。

【0019】上記の組成のガラスにおいては、ガラスの



網目形成酸化物であるSiO2またはB2〇3を20~7 9モル%含むことによってガラスとしての骨格を維持す ることができる。修飾酸化物であるLiO2、Na2O、 K2O、Rb2O、Cs2O、MgO、CaO、SrO、 またはBaOは、ガラスの網目構造を一部破壊するの で、高温での粘性を弱めることや粘性の温度傾斜を緩く するために用いる成分である。本発明の5~60モル% の添加範囲であればガラスを作製することができる。A 12O3またはTiO2は中間酸化物であり、網目形成酸 化物であるSiO2またはB2O3と、修飾酸化物である LiO2, Na2O, K2O, Rb2O, Cs2O, Mg O、CaO、SrO、またはBaOのパランスに応じ て、網目酸化物としても修飾酸化物としてもガラス中で 存在することができる。特に中間酸化物のTi〇2は後 述のようにレーザ加工しきい値を下げるために必須の成 分である。

【0020】上記の組成に溶融したレーザ加工用ガラス 試料に照射エネルギーを変えながら波長266nmのレ ーザ光を照射した。この結果得られた表面加工しきい値 を表2に示す。次にレーザ光の波長を355nmにして 同様の実験を行った。その結果得られた表面加工しきい 値を表3に示す。

【0021】なお、波長266nmのレーザ光照射時のパワーメータで測定可能な最小パワーは15mWであり、その値以下の優劣は比較できなかった。また、波長355nmのレーザ光照射時においては、レーザの安定性の問題により100mW以下を精密に測定できなかった。

【0022】中間酸化物の量を変化させた実施例1~5 では、図1に示すように、TiO2の量が増えるほど、 加工しきい値が低くなっており、実施例5 (TiO2: 25モル%)では測定限界まで加工しきい値が低下して いる。実施例5の組成のうちTiO2の量を変えずに網 目形成酸化物を変化させた実施例6~8では、網目形成 酸化物であるSiO2とB2O3の割合を変化させても、 しきい値は測定限界以下で変わらない。実施例5の組成 のうちTiO2の量を変えずに修飾酸化物の添加量を変 化させた実施例9、10では、修飾酸化物であるとNa 20の量を変化させても、しきい値は測定限界以下で変 わらなかった。網目形成酸化物のSiO2と中間酸化物 のTiO2の量を大きく変えた実施例11、12組成で は、これらの組成でも加工しきい値は、比較例1、2よ りも低く、Ti添加の効果がはたらいている。実施例5 の組成のうちTiО2の量を変えずに修飾酸化物の種類 を変化させた実施例13~18では、修飾酸化物の種類 を変化させても、しきい値は測定限界以下で変わらなか った。

【0023】 [比較例1] 表4に示す組成(モル%)で 原料を調合しガラス試料を作製した。このガラス試料 は、実施例1~5と良く似た組成であるが、実施例と同





様に加工しきい値を求めると、レーザ光の波長が266 nmの時の最大パワー1100mW、レーザ光の波長が355 nmの時の最大パワー2100mWのどちらにおいても、アブレーション若しくは蒸発を起こさず、試料に変化はなかった。

【0024】 [比較例2] 比較例として表5に示す組成 (モル%) の材料を用いた。これは通常の窓ガラスなど に用いられる、いわゆるソーダライムガラスである。実

施例と同様に加工しきい値を求めると、レーザ光の波長が266nmの時の最大パワー1100mW、レーザ光の波長が355nmの時の最大パワー2100mWのどちらにおいても、アブレーション若しくは蒸発を起こさず、試料に変化はなかった。

[0025]

【表1】

(単位:モル%)

成分	実施例 1	実施例2	奥施例 3	実施例 4	実施例 5	実施例 6
SiO ₃	37.2	36.7	87.5	37.5	37.5	50.0
B ₂ O ₃	12.4	12.3	12.5	12.5	12.5	0.0
TiO ₂	0.8	2.0	6.3	12.5	25.0	25.0
Al ₂ O ₃	24.8	24.5	18.7	12.5	0.0	0.0
Na _x O	24.8	24.5	25.0	25.0	25.0	25.0
Li ₂ O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K ₂ O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MgO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SrO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8H	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

成分	実施例7	爽施例 8	実施例 9	実施例 10	実施例 11	実施例 12
SiO ₂	25.0	0.0	10.0	30.0	20.0	79.0
B ₁ O ₁	25.0	50.0	30.0	10.0	0.0	0.0
TiO ₂	25.0	25.0	25.0	25.0	40.0	1,0
Al ₂ O ₈	0,0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Na _x O	25.0	25.0	35.0	35.0	40.0	20.0
Li ₂ O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K ₂ O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MgO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
CaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
SrO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

成分	実施例 13	実施例 14	実施例 15	実施例 16	実施例 17	実施例 18
SiO,	37.5	37.5	87.5	37.5	87.5	37.5
B ₂ O ₃	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5	12.5
TiO ₂	25.0	25.0	25.0	25.0	25,0	25.0
Al _e O ₃	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Na _z O	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Li ₂ O	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
K ₂ O	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
MgO	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
CaO	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
SrO	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0	0.0
BaO	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.0
計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

[0026]

【表2】

	実施例 1	実施例 2	実施例3	実施例 4	実施例 5
加工しきい値(mW)	200	150	80	40	15

	実施例 6	実施例7	実施例8	実施例 9	実施例 10
加工しきい値(mW)	15	15	15	15	15

	実施例 11	奥施例 12	奥施例 13	実施例 14	実施例 15
加工しきい値(mW)	15	200	15	15	15

	実施例 16	実施例 17	実施例 18
加工しきい位(mW)	15	15	15





	実施例 1	実施例 2	実施例3	実施例4	実施例 5
加工しきい値(mW)	900	800	500	400	200

	実施例 6	実施例7	実施例8	奥施例 9	奥施例 10
加工しきい値(mW)	200	100	200	100	200

	実施例 11	実施例 12	実施例 13	実施例 14	実施例 15
加工しきい値(mW)	100	1100	200	200	200

	実施例 16	実施例 17	実施例 18
加工しきい値 (mW)	200	200	200

[0028]

【表4】

(単位:モル%)

成分	比較例1
SiO ₂	37.5
TiO,	0.0
Al ₂ O ₃	25.0
Na ₂ O	25.0
B ₂ O ₃	12.5
計	100.0

【0029】 【表5】

(単位:モル%)

成分	比較例2
SiO ₂	72.0
Al ₂ O ₃	0.9
Na ₂ O	12.7
MgO	6.0
CaO	8.4
計	100.0

【 O O 3 O 】以上より、酸化物ガラス中にチタンを添加することにより、紫外光におけるレーザ加工しきい値は顕著に減少することがわかる。またチタンの添加量が増大するほど加工しきい値は減少する。しかし網目形成酸化物や修飾酸化物の組成にはほとんど依存しない。なお、上記ではチタンはその酸化物の形態で表現しているが、その効果はチタンが原子、コロイドまたはイオンの形態であっても同様である。

【 O O 3 1 】 チタンはガラスの溶融時に添加できるので、添加量の制御は容易であり、したがってレーザ加エ

しきい値を制御しやすい。また溶融時の添加であるため、チタンはガラス中の濃度が均一である。このため、レーザ加工しきい値は被加工ガラス体中で一定であり、ガラス内部に及ぶ加工、例えば貫通孔の形成等が容易に行える。

[0032]

【発明の効果】本発明により、加工に必要なエネルギーが少ない、低加工しきい値ガラスが得られる。さらに溶融によってチタンをガラス中に導入することができるので、チタンの添加量を変えて加工しきい値を制御しやすく、また、均一な加工性を有する材料を得ることができる。

【図面の簡単な説明】

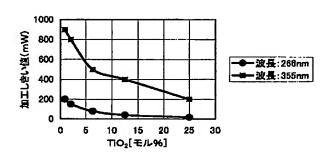
【図1】本発明のレーザ加工用ガラスの加工特性を示す 図である。

【図2】レーザ加工しきい値測定用光学系を示す模式図である。

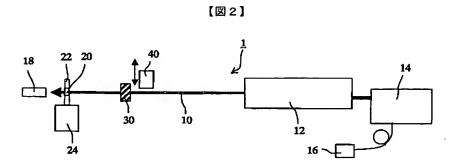
【符号の説明】

- 10 レーザ光
- 12 レーザ光線
- 20 ガラス試料
- 22 試料ホルダ
- 24 試料ステージ
- 30 照射シャッタ
- 40 パワーメータ

【図1】







フロントページの続き

(72) 発明者 常友 啓司

大阪府大阪市中央区北浜4丁目7番28号

日本板硝子株式会社内

Fターム(参考) 4G015 FA07 FA09 FB01 FB03 FC14

4G059 AA01 AA08 AB19 AC01 BB01

4G062 AA01 BB01 BB05 BB06 CC10

DA04 DA05 DA06 DA07 DB03

DB04 DB05 DC04 DC05 DC06

DC07 DD01 DE01 DF01 EA01

EA02 EA03 EA04 EA05 EB01

EB02 EB03 EB04 EB05 EB06

EC01 EC02 EC03 EC04 EC05

EC06 ED01 ED02 ED03 ED04

ED05 ED06 EE01 EF01 EG01

EDOS EDOS ELOT ELOT EGOT

FA01 FB03 FB04 FB05 FC01

FD01 FE01 FF01 FG01 FH01

FJ01 FK01 FL01 GA01 GA10

GB01 GC01 GD01 GE01 HH01

HH03 HH05 HH07 HH09 HH11

HH13 HH15 HH17 HH20 JJ01

JJ03 JJ05 JJ07 JJ10 KK01

KK03 KK05 KK07 KK10 MM01

MM23 MM27 NN32 NN40